(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 28. Februar 2002 (28.02.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/17401 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 25/075, 33/00

33/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/03198

(22) Internationales Anmeldedatum: 22. August 2001 (22.08.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 100 41 686.1 24. August 2000 (24.08.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. OHG [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regensburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ARNDT, Karlheinz [DE/DE]; Bayerwaldstrasse 13, 93059 Regensburg (DE).

BOGNER, Georg [DE/DE]; Am Sandbügel 12, 93138 Lappersdorf (DE). BRUNNER, Herbert [DE/DE]; Winklergasse 16, 93047 Regensburg (DE). WAITL, Günter [DE/DE]; Praschweg 3, 93049 Regensburg (DE).

(74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, KR, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

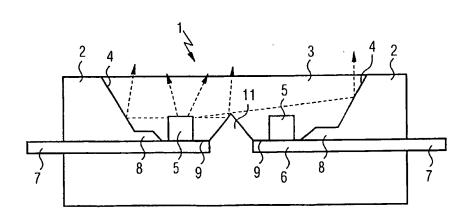
Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r Änderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden Frist; Ver\(\tilde{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: COMPONENT COMPRISING A LARGE NUMBER OF LIGHT-EMITTING-DIODE CHIPS

(54) Bezeichnung: BAUELEMENT MIT EINER VIELZAHL VON LUMINESZENZDIODENCHIPS



(57) Abstract: The invention relates to a component (1) comprising a large number of light-emitting-diode chips (5) in a reflector (3), the latter being configured in such a way that the direct line of vision between the light-emitting-diode chips (5) is interrupted by an intermediate wall (11). This significantly improves the effectiveness of the component (1).

(57) Zusammenfassung: Ein Bauelement (1) mit einer Vielzahl von Lumineszenzdiodenchips (5) in einem Reflektor (3) ist so ausgebildet, daß die unmittelbare Sichtlinie zwischen den Lumineszenzdiodenchips (5) durch eine Zwischenwand (11) unterbrochen ist. Dadurch wird der Wirkungsgrad des Bauelements (1) wesentlich verbessert.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung im ein-5 zelnen anhand der beigefügten Zeichnung erläutert. Es zeigen:

- Figur 1 eine Aufsicht auf ein mit einer Vielzahl von Lumineszenzdiodenchips ausstattbares Bauelement;
- 10 Figur 2 eine Querschnittsansicht entlang der Schnittlinie II-II in Figur 1; und
 - Figur 3 eine Querschnittsansicht durch ein abgewandeltes Ausführungsbeispiel des Bauelements.

15 Figur 1 zeigt eine Aufsicht auf ein Bauelement 1, das nachfolgend anhand der Figuren 1 und 2 näher erläutert wird. Das Bauelement 1 weist ein Gehäuse 2 auf, in dem eine Vertiefung 3 ausgebildet ist. Die Vertiefung 3 mit ihren abgeschrägten Seitenwänden 4 dient als Reflektor für die in der Vertiefung 20 3 angeordneten Lumineszenzdiodenchips 5. Die Lumineszenzdiodenchips 5 sind auf einem Kontaktträger 6 (leadframe) angeordnet, dessen Anschlußelemente 7 seitlich aus dem Gehäuse 2 herausragen. Der Kontaktträger 6 liegt abschnittsweise unter Abdeckschichten 8, die der Fixierung des Kontaktträgers 6 25 dienen. Außerdem ist der Kontaktträger 6 in einzelne Landeplätze für die Lumineszenzdiodenchips 5 und Anschlußflächen 10 für die zum Bonden der Lumineszenzdiodenchips 5 verwendeten Bonddrähte unterteilt. Die zum Anschluß der Lumineszenzdiodenchips 5 verwendeten Bonddrähte sind in den Figuren 1 30 und 2 nicht dargestellt.

Die Lumineszenzdiodenchips 5 sind in dem Gehäuse 2 typischerweise in einem Abstand von 0,8 mm angeordnet, gemessen jeweils von der Mitte der Lumineszenzdiodenchips 5. Zwischen den Landeplätzen 9 für die Lumineszenzdiodenchips 5 befindet sich ein etwa 0,2 mm breiter Spalt. Bei dem in den Figuren 1 10

15

und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel wird der Spalt im Kontaktträger 6 zwischen den Landeplätzen 9 mit der Zwischenwand 11 mit im Querschnitt keilförmigen Wänden ausgenutzt. Durch die Zwischenwand 11 wird der unmittelbare Sichtkontakt zwischen den Lumineszenzdiodenchips 5 unterbrochen. Daher kann die von einem der Lumineszenzdiodenchips 5 ausgehende Strahlung nicht unmittelbar von einem der anderen Lumineszenzdiodenchips 5 absorbiert werden. Aus diesem Grund ist die Lichtleistung des Bauelements 1 in etwa gleich der Summe der Lichtleistungen der einzelnen Lumineszenzdiodenchips 5.

Durch den keilförmigen Querschnitt der Zwischenwand 11 ist sichergestellt, daß das auf die Zwischenwand 11 auftreffende Licht nach außen reflektiert wird. Die Höhe der Zwischenwand 11 sollte vorteilhafterweise bis zu 25 %, vorzugsweise bis zu 10 %, über der Höhe der Lumineszenzdiodenchips 5 liegen. Die Höhe wird dabei jeweils vom Boden der Vertiefung 3 aus gemessen. Falls die Höhe der Zwischenwand 11 unterhalb der Höhe der Lumineszenzdiodenchips 5 liegt, wird die Sichtlinie zwischen den Lumineszenzdiodenchips 5 nicht vollständig unterbrochen. Wenn umgekehrt die Höhe der Zwischenwand 11 zu groß ist, nimmt die Zwischenwand 11 aufgrund der keilförmigen Wände zuviel Platz in Anspruch. Für die Höhe der Zwischenwand 11 ist demnach jeweils die Abstrahlcharakteristik der Lumineszenzdiodenchips 5 maßgeblich. Falls die Lumineszenzdiodenchips 5 hauptsächlich nach unten abstrahlen, kann auch die Höhe der Zwischenwand 11 kleiner als die Höhe der Lumineszenzdiodenchips 5 sein.

Zur Herstellung des Bauelements 1 wird zunächst der Kontaktträger 6 mit einem thermoplastischen Kunststoff oder Duroplast umspritzt und dann die Lumineszenzdiodenchips 5 auf den Landeplätzen 9 abgesetzt und gebondet. Anschließend wird die Vertiefung 3 mit einem für die Strahlung der Lumineszenzdiodenchips 5 transparenten Harz gefüllt. 10

20

4

Es sei angemerkt, daß das gleiche Verfahren auch dann angewendet werden kann, wenn der Kontaktträger 6 durch eine vollständige Leiterplatte ersetzt ist. In diesem Fall wird die Leiterplatte im Bereich der Lumineszenzdiodenchips 5 mit einem Gehäuse 2 versehen, das auf die Leiterplatte aufgespritzt wird.

Figur 3 zeigt eine Querschnittsansicht durch ein abgewandeltes Ausführungsbeispiel des Bauelements 1. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird zunächst das Gehäuse 2 ausgebildet und dann auf der Oberfläche des Gehäuses 2 die erforderlichen Leiterbahnen 12 hergestellt. Dazu kann die sogenannte CIMID-Technik verwendet werden. Im Rahmen dieser Technik wird zunächst auf der Oberfläche des Gehäuses 2 eine dünne Metallschicht in einer wässrigen Lösung abgeschieden und anschließend mit einem Laser strukturiert. Die so strukturierte Metallschicht wird anschließend auf galvanischem Wege verdickt. Die Anwendung dieses Verfahrens hat den Vorteil, daß auch die Zwischenwand 11 mit einer reflektierenden Metallschicht überzogen werden kann. Dadurch wird der Wirkungsgrad des Bauelements 1 weiter verbessert.

20

Patentansprüche

schenwand (11) angeordnet ist.

- Optoelektronisches Bauelement mit einer Mehrzahl von Lumineszenzdiodenchips (5), die nebeneinander in einem gemeinsamen Reflektor (3) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen jeweils zwei Lumineszenzdiodenchips (5) je eine Zwi-
- 2. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektor (3) von einer Vertiefung in einem Kunststoff-Gehäuse (2) gebildet ist.
- 3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Zwischenwand (11) von einem reflektierenden Trennsteg gebildet ist, der insbesondere einen keilförmigen Querschnitt aufweist.
- Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
 die Lumineszenzdiodenchips (5) auf einem Kontaktträger (6)
 angeordnet sind, der am Boden des Reflektors (3) bzw. der
 Vertiefung verläuft.
 - 5. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
- 30 dadurch gekennzeichnet, daß die Lumineszenzdiodenchips (5) an Leiterbahnen (12) befestigt sind, die auf dem Reflektor (3) bzw. in der Vertiefung auf dem Gehäuse (2) ausgebildet sind.
- 6. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß

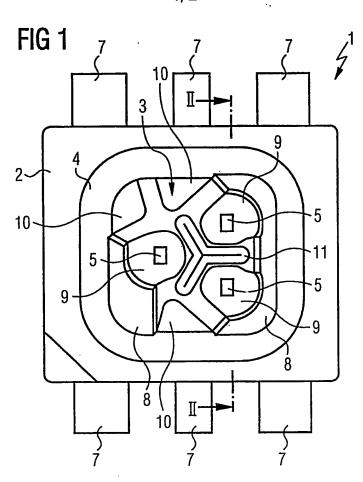
der Reflektor (3) mit einem für die Strahlung der Lumineszenzdiodenchips (5) transparenten Kunstharz vergossen ist.

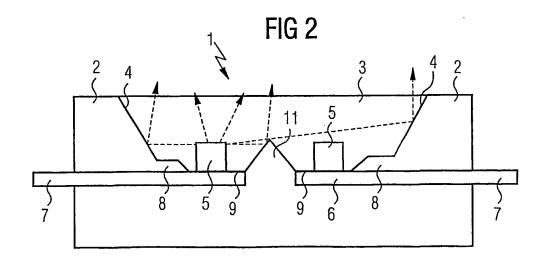
- 7. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 5 bis 6,
 - dadurch gekennzeichnet, daß mindestens drei Lumineszenzdiodenchips (5) derart im Reflektor (3) angeordnet sind, daß sie auf den Eckpunkten eines gedachten Vielecks angeordnet sind, und Zwischenwände (11) zwischen den Lumineszenzdiodenchips (5) sternartig auseinanderlaufen.
 - 8. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
- dadurch gekennzeichnet, daß die jeweils zwei Lumineszenzdiodenchips (5) voneinander einen Abstand zwischen 0,5 mm und 1 mm, insbesondere von etwa 0,8 mm aufweisen, gemessen jeweils von der Mitte der Lumineszenzdiodenchips (5).

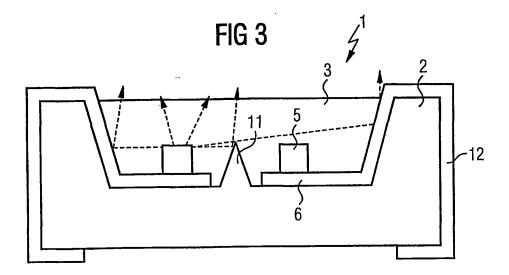
20

- 9. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
- dadurch gekennzeichnet, daß die Höhe der Zwischenwand (11) bis zu 25 %, insbesondere bis zu 10 % über der Höhe der Lumineszenzdiodenchips (5) liegen.
 - 10. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 2 oder nach einem der Ansprüche 3 bis 9 unter Rückbezug auf Anspruch 2, dad urch gekennzeichnet, daß
- die Zwischenwand (11) zwischen den jeweils zwei Lumineszenzdiodenchips (5) an das Kunststoff-Gehäuse (2) angeformt ist.









INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte al Application No PCT/DE 01/03198

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L25/075 H01L33/00	
	1
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC	
B. FIELDS SEARCHED	
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L	
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched	1
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)	
EPO-Internal, PAJ	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
Category • Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	netevani to dami No.
X PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 10, 30 November 1995 (1995-11-30) -& JP 07 176791 A (ROHM CO), 14 July 1995 (1995-07-14) abstract	1-6,8-10
X PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 08, 29 September 1995 (1995-09-29) -& JP 07 121123 A (SANYO ELECTRIC CO), 12 May 1995 (1995-05-12) paragraphs '0013!, '0026!; figures 2-12	1-5,8-10
-/	
X Further documents are listed in the continuation of box C.	nex.
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disciosure, use, exhibition or other means "P" document published after the international cited to understand the principle or theory understand th	application but underlying the control of invention onsidered to int is taken atone of invention or step when the her such docu- a person skilled
Date of the actual completion of the International search Date of mailing of the International search re	eport
9 January 2002 16/01/2002	
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswifk Tel. (-31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Authorized officer Authorized officer van der Linden, J.E.	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte ral Application No PCT7DE 01/03198

MANUAL PROPRIENTS CONSIDERED TO BE BELEVANT	
	Relevant to claim No.
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 02, 29 February 2000 (2000-02-29) -& JP 11 307818 A (MATSUSHITA ELECTR CO), 5 November 1999 (1999-11-05) paragraphs '0041!-'0047!; figures 5,6	1-3,7,8
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 318 (E-650), 29 August 1988 (1988-08-29) & JP 63 081873 A (TOSHIBA CORP), 12 April 1988 (1988-04-12) abstract	1-3,8-10
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 326 (E-1565), 21 June 1994 (1994-06-21) & JP 06 077540 A (SANYO ELECTRIC CO), 18 March 1994 (1994-03-18) paragraphs '0008!,'0011!; figures 2,5	1,2,4-6, 8-10
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 173 (E-259), 9 August 1984 (1984-08-09) & JP 59 067674 A (TOSHIBA KK), 17 April 1984 (1984-04-17) abstract	1,3-6,8
DE 37 19 338 A (YUE WEN CHENG) 29 December 1988 (1988-12-29) the whole document	1,4-6
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 053 (E-1498), 27 January 1994 (1994-01-27) & JP 05 275747 A (ROHM CO LTD), 22 October 1993 (1993-10-22) abstract	1,3-5
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 233 (P-1049), 17 May 1990 (1990-05-17) -& JP 02 058089 A (MATSUSHITA ELECTR CO), 27 February 1990 (1990-02-27) the whole document	1,3,6
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 04, 31 May 1995 (1995-05-31) & JP 07 015044 A (NICHIA CHEM IND), 17 January 1995 (1995-01-17) abstract	1
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 02, 29 February 2000 (2000-02-29) -& JP 11 307818 A (MATSUSHITA ELECTR CO), 5 November 1999 (1999-11-05) paragraphs '0041!-'0047!; figures 5,6 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 318 (E-650), 29 August 1988 (1988-08-29) & JP 63 081873 A (TOSHIBA CORP), 12 April 1988 (1988-04-12) abstract PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 326 (E-1565), 21 June 1994 (1994-06-21) & JP 06 077540 A (SANYO ELECTRIC CO), 18 March 1994 (1994-03-18) paragraphs '0008!, '0011!; figures 2,5 —— PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 173 (E-259), 9 August 1984 (1984-08-09) & JP 59 067674 A (TOSHIBA KK), 17 April 1984 (1984-04-17) abstract —— DE 37 19 338 A (YUE WEN CHENG) 29 December 1988 (1988-12-29) the whole document —— PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 053 (E-1498), 27 January 1994 (1994-01-27) & JP 05 275747 A (ROHM CO LTD), 22 October 1993 (1993-10-22) abstract PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 233 (P-1049), 17 May 1990 (1990-05-17) -& JP 02 058089 A (MATSUSHITA ELECTR CO), 27 February 1990 (1990-02-27) the whole document PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 04, 31 May 1995 (1995-05-31) & JP 07 015044 A (NICHIA CHEM IND), 17 January 1995 (1995-01-17)

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

formation on patent family members

Inte at Application No PCT7DE 01/03198

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
JP 07176791	Α	14-07-1995	NONE		
JP 07121123	Α	12-05-1995	NONE		
JP 11307818	A	05-11-1999	NONE		
JP 63081873	Α	12-04-1988	NONE		
JP 06077540	A	18-03-1994	NONE		
JP 59067674	A	17-04-1984	NONE		
DE 3719338	A	29-12-1988	DE FR GB	3719338 A1 2617664 A1 2206444 A	29-12-1988 06-01-1989 05-01-1989
JP 05275747	A	22-10-1993	NONE		
JP 02058089	A	27-02-1990	NONE		
JP 07015044	Α	17-01-1995	JP	2790237 B2	27-08-1998

Form PCT/(SA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte nates Aktenzeichen PCT/DE 01/03198

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L25/075 H01L33/00	
Nach der Internationalen Pateniklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK	
B. RECHERCHIERTE GEBIETE	
Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L	
Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete	
Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evti. verwendete S EPO-Internal, PAJ	suchbegrii7e)
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teille	Beir. Anspruch Nr.
X PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 10, 30. November 1995 (1995-11-30) -& JP 07 176791 A (ROHM CO), 14. Juli 1995 (1995-07-14) Zusammenfassung	1-6,8-10
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 08, 29. September 1995 (1995-09-29) -& JP 07 121123 A (SANYO ELECTRIC CO), 12. Mai 1995 (1995-05-12) Absätze '0013!, '0026!; Abbildungen 2-12 -/	1-5,8-10
Nobe Ashers Detentionille	
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist der nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist handlicht kollidiert, sondern nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L' Veröffentlichten veröffentlicht worden ist "L' Veröffentlichten die des Veröffentlichung seinen anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht gene Benutzung, die wordem internationalen Anmeldedatum, aber nach der der Veröffentlichung die ser Kalegorie in Veröffentlichung die veröffentlichung die veröffentlichung die se Verbindung für einen Fachman gene der dem Prioritälisdatum veröffentlichung der dem Prioritälisdatum veröffentlichung den der dem Prioritälisdatum veröffentlichung den den Prioritälisdatum veröffentlichung den der dem Prioritälisdatum veröffentlichung den der dem Prioritälisdatum veröffentlichung den der dem Prioritälisdatum veröffentlichung den den der Profitalisdatum veröffentlichung den der dem Prioritälisdatum veröffentlichung den der dem Prioritälisdatum veröffentlichung den de	ur zum Verständnis des der s oder der ihr zugrundellegenden situng; die beanspruchte Erfindung lichung nicht als neu oder auf rachtet werden sutung; die beanspruchte Erfindung jakel beruhend betrachtet ill einer oder mehreren anderen n arbeilegend ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des Internationalen R	lecherchenberichts
9. Januar 2002 16/01/2002 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentlaan 2	
Europaisches Fatentam, P.B. 5816 Patentam 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	J.E.

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Seite 1 von 2

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte ales Aktenzeichen
PCT/DE 01/03198

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Kategorie*	Bezeichnung der Veronienllichung, soweil entstallich unter August der in State	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 02, 29. Februar 2000 (2000-02-29) -& JP 11 307818 A (MATSUSHITA ELECTR CO), 5. November 1999 (1999-11-05) Absätze '0041!-'0047!; Abbildungen 5,6	1-3,7,8
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 318 (E-650), 29. August 1988 (1988-08-29) & JP 63 081873 A (TOSHIBA CORP), 12. April 1988 (1988-04-12) Zusammenfassung	1-3,8-10
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 326 (E-1565), 21. Juni 1994 (1994-06-21) & JP 06 077540 A (SANYO ELECTRIC CO), 18. März 1994 (1994-03-18) Absätze '0008!,'0011!; Abbildungen 2,5	1,2,4-6, 8-10
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 173 (E-259), 9. August 1984 (1984-08-09) & JP 59 067674 A (TOSHIBA KK), 17. April 1984 (1984-04-17) Zusammenfassung	1,3-6,8
X	DE 37 19 338 A (YUE WEN CHENG) 29. Dezember 1988 (1988-12-29) das ganze Dokument	1,4-6
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 053 (E-1498), 27. Januar 1994 (1994-01-27) & JP 05 275747 A (ROHM CO LTD), 22. Oktober 1993 (1993-10-22) Zusammenfassung	1,3-5
x	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 233 (P-1049), 17. Mai 1990 (1990-05-17) -& JP 02 058089 A (MATSUSHITA ELECTR CO), 27. Februar 1990 (1990-02-27) das ganze Dokument	1,3,6
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 04, 31. Mai 1995 (1995-05-31) & JP 07 015044 A (NICHIA CHEM IND), 17. Januar 1995 (1995-01-17) Zusammenfassung	

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

Seite 2 von 2

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichuf die zur selben Patenttamilie gehören

nales Aktenzelchen PCT7DE 01/03198

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
JP 07176791	A	14-07-1995	KEINE		
JP 07121123	A	12-05-1995	KEINE		
JP 11307818	A	05-11-1999	KEINE		
JP 63081873	A	12-04-1988	KEINE		مرادات بين م مرادات بين مرادات بين
JP 06077540	A	18-03-1994	KEINE		
JP 59067674	A	17-04-1984	KEINE		د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
DE 3719338	Α	29-12-1988	DE FR GB	3719338 A1 2617664 A1 2206444 A	29-12-1988 06-01-1989 05-01-1989
JP 05275747	Α	22-10-1993	KEINE		
JP 02058089	Α	27-02-1990	KEINE		ب است به برشر در در در در در در
JP 07015044	Α	17-01-1995	JP	2790237 B2	27-08-1998

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentiamille)(Juli 1992)